

PSA-11 ポスター発表一覧

番号	題目	発表者	所属
P01	極低角度入射ビームを用いた高感度、高分解能オージェ深さ方向分析による極薄膜多層試料の分析	○荻原俊弥, 永富隆清, 田沼繁夫	物質・材料研究機構, 大阪大学
P02	ToF-SIMS GW 活動報告 ラウンドロビンテスト10報告	○伊藤博人, SASJ TOF-SIMS WG	ユニカミノルタテクノロジーセンター株式会社
P03	TOF-SIMS WG活動報告 TOF-SIMSの質量軸較正法に関するラウンドロビンテスト09(RRT-09)最終報告	○大友晋哉, SASJ TOF-SIMSワーキンググループ	古河電気工業(株)横浜研究所
P04	GaAsおよびGaN表面上微量金属のTOF-SIMS相対定量の検討	○大友晋哉, 東純史	古河電気工業(株)横浜研究所
P05	3次元アトムプローブにおける電界蒸発機構の結晶方位依存性に関する研究	○清水 真人, 森田 真人, 花岡 雄哉, 尾張 真則	東京大学生産技術研究所
P06	レクチン修飾探針を用いたモデル生体膜における糖鎖の2次元分布可視化	○井上滋登, 中原佳夫, 門晋平, 田中睦生, 木村恵一	花王株式会社 解析科学研, 和歌山大学システム工学部
P07	金基板上単分子膜のXPS測定時における試料損傷	○齊藤 純輝, 倉山 文男, 古澤 毅, 佐藤正秀, 鈴木 昇	宇都宮大学大学院 工学研究科
P08	TOF-SIMS測定における導電性試料表面の形状と電場効果	○飯田真一, 眞田則明	アルバック・ファイ株式会社
P09	「深さ分解能」に関するアンケートへの回答のまとめ(第一報)	○永富隆清	大阪大学
P10	近赤外分析法を用いた酸化チタン粉末の表面特性	○小林洋子	合同会社近赤外応用技術研究所
P11	Arガスクラスターイオンビームの最適照射条件とXPS分析への応用	○宮山卓也, 眞田則明, 戸津美矢子	アルバック・ファイ株式会社
P12	電子線ホログラフィーによる半導体中のドーパント分布	○佐々木宏和	古河電工(株)
P13	電子線ホログラフィーを用いた化合物半導体中キャリア分布評価における試料加工表面ダメージの影響	○大友晋哉, 佐々木宏和	古河電気工業(株)横浜研究所
P14	固体中の電子の非弾性散乱に関するモデルエネルギー損失関数の評価	○篠塚寛志, 吉川英樹, 田沼繁夫	物質・材料研究機構